

مقاله نامه ششمین کنفرانس ملّی خلأ ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲



بررسي تأثير ضخامت لايه آهن بر مقاومت مغناطيسي نانوساختارهاي Fe/Cu/Fe

افشاری، مهدی؛ قاضی، محمدابراهیم؛ ایزدیفرد، مرتضی

گروه فیزیک دانشگاه شاهرود، میدان هفت تیر، شاهرود

### چکيده

در اين مقاله، تأثير ضخامت لايه فرومغناطيس آهن بر روى مقاومت مغناطيسي نانوساختارهاي سه لايهاي آهن/ مس/ آهن، تهيه شده به روش تبخير حرارتي در خلأ، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مقاومت مغناطیسی نمونه های با ضخامت متفاوت لایه آهن (۱۱– ۲۰ و ۳۰ نانومتر) و ضخامت ثابت (۱۳ نانومتر) لایه مس، به روش چهار اتصالی و با استفاده از قاعده ون- در- پاو، در دمای اتاق اندازهگیری شد. نتایج نشان دادند که با افزایش ضخامت لایه مغناطیسی آهن، مقاومت مغناطیسی نمونهها کاهش می یابد که این می تواند ناشی از کاهش پراکندگی وابسته به اسپین الکترونهای رسانش باشد. مقاومت مغناطیسی همه نمونهها در میدان مغناطیسی حدود ۵۰۰ اورستد به اشباع رسیدند.

Effect of Fe layer thickness on magneto resistance of Fe/Cu/Fe nanostructures

Afshari, Mehdi; Ghazi, Mohammad Ebrahim; Izadifard, Morteza Physics Department, Shahrood University, Shahrood

#### Abstract

In this article, the effects of Fe layer thickness on magneto resistance of Fe/Cu/Fe nanostructures were investigated. The samples were prepared by thermal evaporation method. Magnetoresistance of samples with different Fe layer thickness (16-20-30 nm) and constant thickness (13 nm) of Cu layer are measured by using four point probe and Van Der Pauw methods, in room temperature. The results indicated that by increasing Fe magnetic layer thickness, the magneto resistance of samples reduced, that can be due to decreasing spindependent scattering of conduction electrons. Magneto resistance of Samples become saturated in magnetic field of about 500 Oe.

مقادیر GMR بیشتری ( ۲۵٪ در دمای اتاق و ۱۲۰٪ در دمای ۲.

کلوین ) برای ساختارهای Co/Cu گزارش کردند [۱]. امروزه بر

یایه اثر GMR انواع قطعات مختلف از قبیل: حسگرهای

مغناطیسی، هدهای مغناطیسی و MRAM ها ساخته شدهاند.

منشأ اثر GMR، به یراکندگی وابسته به اسپین الکترونهای رسانشی

نسبت داده می شود. علاوه بر این، محل مراکز پراکندگی ها نیز

اهمیت دارد. این پراکندگیها می توانند در سطح لایه فصل مشترک

یکی از مثالهای قابل توجه در اینگونه ساختارها، چندلایههای

Fe/Cu مي باشند كه از تركيب فلزات انحلال نايذير آهن و مس

و یا در لایه های فرومغناطیس اتفاق بیافتند [۲].

مقدمه

رشد و مطالعه نانوساختارهای فلزی لایهای در سالهای اخیر بطور گستردهای مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از دلایل مهم این توجهات، مشاهده اثر مقاومت مغناطیسی بزرگ (GMR) در ساختارهایی است که در آنها لایههای فرومغناطیس توسط یک لایه غيرمغناطيسي جداشدهاند. افراد زيادي بر روى اين اثر تحقيق کردهاند. اولین بار در سال ۱۹۸۸ بیبیچ<sup>۱</sup> و همکاران، اثر GMR را در ساختار Fe/Cr مشاهده کردند. همچنین، یارکین و همکاران

<sup>1</sup> Baibich <sup>2</sup> Parkin

www.SID.ir



مقاله نامه ششمین کنفرانس ملّی خلاً ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲



تشکیل شدهاند. مطالعات زیادی بر روی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوساختارهای چندلایهای Fe/Cu، تهیه شده به روش-های فیزیکی مثل: اسپاترینگ، روآراستی پرتو مولکولی و تبخیر پرتوالکترونی انجام شده است [۳].

مقاومت مغناطیسی بصورت تغییر مقاومت الکتریکی در یک میدان مغناطیسی خارجی اعمال شده به نمونه تعریف می شود که می توان بصورت معادله ۱ بیان کرد:

MR = (R(H) - R(Hs)) / R(Hs) (1)
که در آن (R(H) مقاومت در میدان H و (R(Hs) مقاومت در میدان اشباع Hs است. این معادله به فرم دیگری نیز نوشته می شود
که بجای (R(Hs) مقاومت بدون حضور میدان (R(H=0) قرار می گیرد.

در این تحقیق، نانوساختارهای سهلایهای Fe/Cu/Fe به روش تبخیر حرارتی در خلأ تهیه شدند. مقاومت مغناطیسی این نمونهها با استفاده از روش چهارمیلهای و در حضور میدان مغناطیسی اندازه گیری شد و تأثیر ضخامت لایه مغناطیسی آهن (ضخامت لایه مس ثابت) بر مقاومت مغناطیسی این نمونهها مورد بررسی قرار گرفت.

#### مواد و روشها

برای تهیه نانوساختارهای سهلایهای Fe/Cu/Fe، از پودر آهن با خلوص ۹۹/۹۹٪ و رشتههای بریده شده مس با خلوص بالاتر از ۹۹٪ به عنوان مواد اولیه استفاده شد. نمونهها با استفاده از روش تبخیر در خلأ بر روی زیرلایه شیشه، با فشار محفظه تور و در دمای اتاق تهیه گردیدند که ضخامتهای لایههای انباشت شده در جدول ۱ آمده است. لایهها بطور متوالی و بدون شکستن خلأ لایهنشانی شدهاند و ضخامت آنها در حین انباشت با ضخامت سنج بلور کوارتز اندازه گیری شده است. لازم به ذکر است که ضخامت لایههای ذکر شده در جدول ۱ با دقت ۱nm گرد شدهاند.

جدول ۱- ضخامتهای لایههای انباشت شده.

ئمونه	ضخامت لايه اول	ضخامت لايه دوم	ضخامت لايه سوم
	آهن ( nm )	مس (nm)	آهن (nm)
١	١٦	۱۳	١٦
۲	۲.	١٣	۲.
٣	٣٠	١٣	٣٠

مقاومت مغناطیسی نمونهها، به روش چهارمیلهای و با استفاده از قاعده ون- در- پاو<sup>۳</sup>، در دمای اتاق اندازه گیری شد [4]. بدین منظور، تعداد چهار عدد سیم مسی، با استفاده از چسب نقره در گوشههای نمونه چسبانده شدند. قبل از اندازه گیری مقاومت مغناطیسی، رفتار اهمی اتصالات بررسی شد. اندازه گیری مقاومت مغناطیسی نمونهها در یک میدان مغناطیسی موازی با سطح نمونه انجام گردید.

## نتايج و بحث

اندازه گیری مقاومت مغناطیسی نمونه ها، در دو حالت میدان موازی با جهت جریان و میدان عمود بر جهت جریان، انجام شد. بازه تغییر میدان مغناطیسی از ۳۰۰۰ – تا ۳۰۰۰ اورستد بوده و مقاومت مغناطیسی نمونه ها بر حسب میدان، با استفاده از معادله ۱ محاسبه شد.

شکل ۱ (الف و ب) نمودارهای مربوط به تغییرات مقاومت مغناطیسی بر حسب میدان اعمال شده به نمونهها، در دو حالت موازی و عمود بر جهت جریان را نشان می دهد. نتایج حاصل از اندازه گیریها در جدول ۲ آورده شده است. همانطور که ملاحظه می شود، در هر دو حالت، با افزایش ضخامت لایه مغناطیسی آهن، مقاومت مغناطیسی نمونهها کاهش می یابد. همچنین، مقایسه شکل-های الف و ب برای هر نمونه، نشان می دهد که مقاومت مغناطیسی در حالت میدان موازی با جهت جریان، بیشتر از حالت میدان عمود بر جهت جریان است. مقاومت مغناطیسی همه نمونهها در میدان حدود ۵۰۰ اورستد، به اشباع رسید.

<sup>3</sup> Van- Der- Pauw



مقاله نامه ششمین کنفرانس ملّی خلأ ایران

شكل ۲- مقاومت مغناطيسي نمونهها بر حسب ضخامت لايه مغناطيسي آهن؛ الف) میدان مغناطیسی موازی با جهت جریان، ب) میدان مغناطیسی عمود بر جهت جريان.

# نتيجه گيري

در این مقاله نانوساختارهای سهلایهای Fe/Cu/Fe، با ضخامتهای متفاوت لایه مغناطیسی آهن و ضخامت ثابت لایه غیرمغناطیس مس به روش تبخیر در خلاً تهیه شدند.



موازي با جهت جريان، ب) ميدان مغناطيسي عمود بر جهت جريان.

جدول ۲ - نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت مغناطیسی سهلایههای Fe/Cu/Fe با ضخامتهای آهن متفاوت در میدانهای موازی و عمود بر جهت جريان.

مقاومت مغناطیسی جهت میدان اعمال شده	Fe = 16 nm MR%	Fe = 20 nm MR%	Fe = 30 nm MR%
میدان موازی با جوت جریان	۰,٦٤	٠,١٤	۰,۱۰
بهت جريان			
ميدان عمود بر جهت جر بان	•,0٦	•,•21	•,•12
- 19 · · ·			

شکل ۲ (الف و ب) تغییرات مقاومت مغناطیسی نمونهها بر حسب ضخامت لايه آهن را نشان مي دهد. همانطور كه شكل



مقاله نامه ششمین کنفرانس ملّی خلاً ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲



مقاومت مغناطیسی نمونهها به روش چهارمیلهای و با استفاده از قاعده ون– در– پاو اندازهگیری شد. اندازهگیری مقاومت مغناطیسی در دو حالت میدان موازی و عمود بر جهت جریان و در دمای اتاق انجام گرفت.

نتایج نشان دادند که با افزایش ضخامت لایه مغناطیسی آهن، مقاومت مغناطیسی نمونهها کاهش مییابد. همچنین، مقایسه دو حالت میدان موازی با جهت جریان و میدان عمود بر جهت جریان، نشان داد که مقاومت مغناطیسی در حالت میدان موازی با جهت جریان بیشتر است. این تغییرات میتواند ناشی از کاهش پراکندگی وابسته به اسپین الکترونهای رسانش باشد. اشباع مقاومت مغناطیسی همه نمونهها در میدان حدود ۵۰۰ اورستد اتفاق افتاد.

مرجعها

 S. J. Lee et al; "In-Plane Resistivity and Magnetoresistivity Study for Fe/Al Trilayered Films"; *Jornal of Korean Physical Society 31*, No.3 (1997) 486-490.
N. H. Duc; "Low- field magnetoresistance of Fe/Cr multilayers"; *Physica B*, No. 327 (2003) 334-336.
C. Rizal; "Magnetic Properties of Fe/Cu Multilayers Prepared Using Pulsed- Current Electrodepositio"; *Jornal of Nano- And Electronic Physics 4*, No. 1 (2012) 01001-01003.
A. Bartels; "A Precedure for Temperature Dependent, Different Van Der Pauw Measurment"; *Jornal of Applied Physics 66*, No. 8 (1995) 4271-4276.

TCY